一般社団法人 日本非破壊検査協会
2023年度非破壊検査総合シンポジウム スケジュール（予定）

期　日：２０２３年６月７日（水）～８日（木）
会　場：(一社)日本非破壊検査協会　亀戸センター
（東京都江東区亀戸2-25-14 立花ｱﾈｯｸｽﾋﾞﾙ6階）

第１日目　６月７日（水）

開　会　式	９：１０～　９：２０
イベント	９：３０～１６：３０
特別講演	１６：４５～１７：４５
懇　親　会	１８：１５～２０：１５

開会の挨拶　9：10 ～ 9：20
（会場：第１会場）

第１会場：《学術委員会・NDE4.0対応WG・UT部門・特別講演》
9:30～12:10　NDE4.0の動向と協会としての取組み
13:10～16:30　超音波を用いたイメージング技術の新展開Ⅰ，Ⅱ
16:45～17:45　特別講演

第２会場：《MT/PT/VT・ET/MFLT・LT部門合同》
9:30～11:40　表面NDTワークショップ(1),(2)
13:30～16:20　表面NDTワークショップ(3),(4)

第３会場：《SSM部門・RT部門》
9:30～11:20　応力・ひずみ測定と強度評価Ⅰ，Ⅱ
13:30～16:20　特長のあるX線管・X線発生装置とその技術Ⅰ，Ⅱ

懇　親　会　18：15　～　20：15
会場：アンフェリシオン　江東区亀戸1-43-22
03-5836-5111　(http://www.anfelicion.jp/access/)

参加登録料：　（消費税込）

種別	5月30日 迄
会　　員	5,000円
一　　般 §1	12,000円
学生会員	2,000円
学生一般 §1	5,000円
懇親会費	5,000円

※　**参加申込締切は5月30日（火）迄です。**
※　今回のシンポジウムを機会に、当協会会員に新規入会されることをお勧めいたします。
§1　一般の方：上記締切後は参加登録料が変わります。
一般：16,000円、学生一般：8,000円

第２日目　６月８日（木）

イベント	９：００～１２：００
社員総会	１４：００～１５：００

第１会場：《TT部門》
9:30～12:00　赤外線サーモグラフィとその周辺技術

第２会場：《cosα法方式のX線残留応力測定法研究会》
9:00～12:00　二次元検出器及びcosα法によるX線応力測定法Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

第３会場：《標準化委員会》
9:30～11:50　標準化委員会の活動及び規格の制定・改定の解説*1
*1 本セッションは参加登録料が無料となっております。

【会 場 案 内 図】

一般社団法人 日本非破壊検査協会
亀戸センター
JR総武線・東武亀戸線「亀戸駅」下車、北口より徒歩 約５分

＊講演中のカメラやスマートフォン等による撮影は原則禁止としております。撮影される場合は、事前に登壇者の了承を得た上で，登壇前に座長へ申し出るようにお願いいたします。

＊講演概要集：PDF形式でダウンロード配付(パスワードはシンポジウム初日に参加登録者へメール配信)。後日、CDにデータを保存して配送いたします。(印刷物での配布はいたしません。)
＊参加申込：参加申込をされる方は、協会ホームページ（http://www.jsndi.jp/）の「学術活動」→「総合シンポジウム」→「参加申込」よりお申し込みください。
＊最新情報につきましては、ホームページにて順次公開させていただきます。誠にお手数をお掛けいたしますが、ホームページでご確認いただきますようお願い申し上げます。
＊問合先：(一社)日本非破壊検査協会　学術部学術課　TEL： 03-5609-4015　E-mail： taikai@jsndi.or.jp